

# TESCAN SOLARIS 2

来自欧洲捷克：具有优异纳米加工能力的超高解析FIB-SEM

TESCAN SOLARIS 2 是一款全自动镱离子 FIB-SEM，专为高精度 TEM 薄片制备设计，配备人工智能驱动的 TEM AutoTEM Pro™ 软件。此系统适用于失效分析、研发和质量控制，无缝集成先进的 SEM 和 FIB 对准，确保系统始终处于就绪状态并缩短获得数据的时间。

SOLARIS 2 能出色的处理各种电子设备，包括最新的逻辑、存储器、电源和显示技术，为您提供可靠的样品制备性能。



## FIB-SEM 解决方案优势

快速、精确的 TEM 样品

- 使用 TESCANA TEM AutoPrep™ Pro，可在一小时内制作出10 纳米以下的超薄 TEM 样品。从取出到最后的 FIB 抛光均为全自动操作，每次都能提供始终如一的卓越效果。

先进设备的精确定位

- 利用人工智能驱动的靶标识别和 Triglav™ 扫描电镜镜筒的高分辨率成像，精确瞄准 GAA 或 FinFET 器件中的单个晶体管线路。

使用 OptiLift™ 的可适应性薄片制备系统

- 使用 OptiLift™ 纳米机械手操作，毫不费力地制备自上而下、平面和倒置薄片，这种创新设计无需额外的翻转装置，简化了工作流程。

时刻待命，精确校准

- 自动电子镜筒和离子镜筒校准可在夜间运行，确保最少的设置和最长的正常运行时间，让您的系统随时准备就绪。

卓越的高分辨率成像技术

- Triglav™ 扫描电镜镜筒专为超高分辨率成像而设计，具有出色的表面灵敏度和对比度，是光束敏感材料的理想选择。

有效优化工作效率

- 重新设计的 TESCANA TEM AutoPrep™ Pro 可为任何 TEM 样品工作流程提供直观的流程导航和广泛的自定义功能，从而提高每位用户的工作效率。

